

多層膜の深さ方向解析

【分析方法】

- SIMS (二次イオン質量分析計)
- FE - AES (電界放射走査型オージェ電子分光分析)

【特徴】

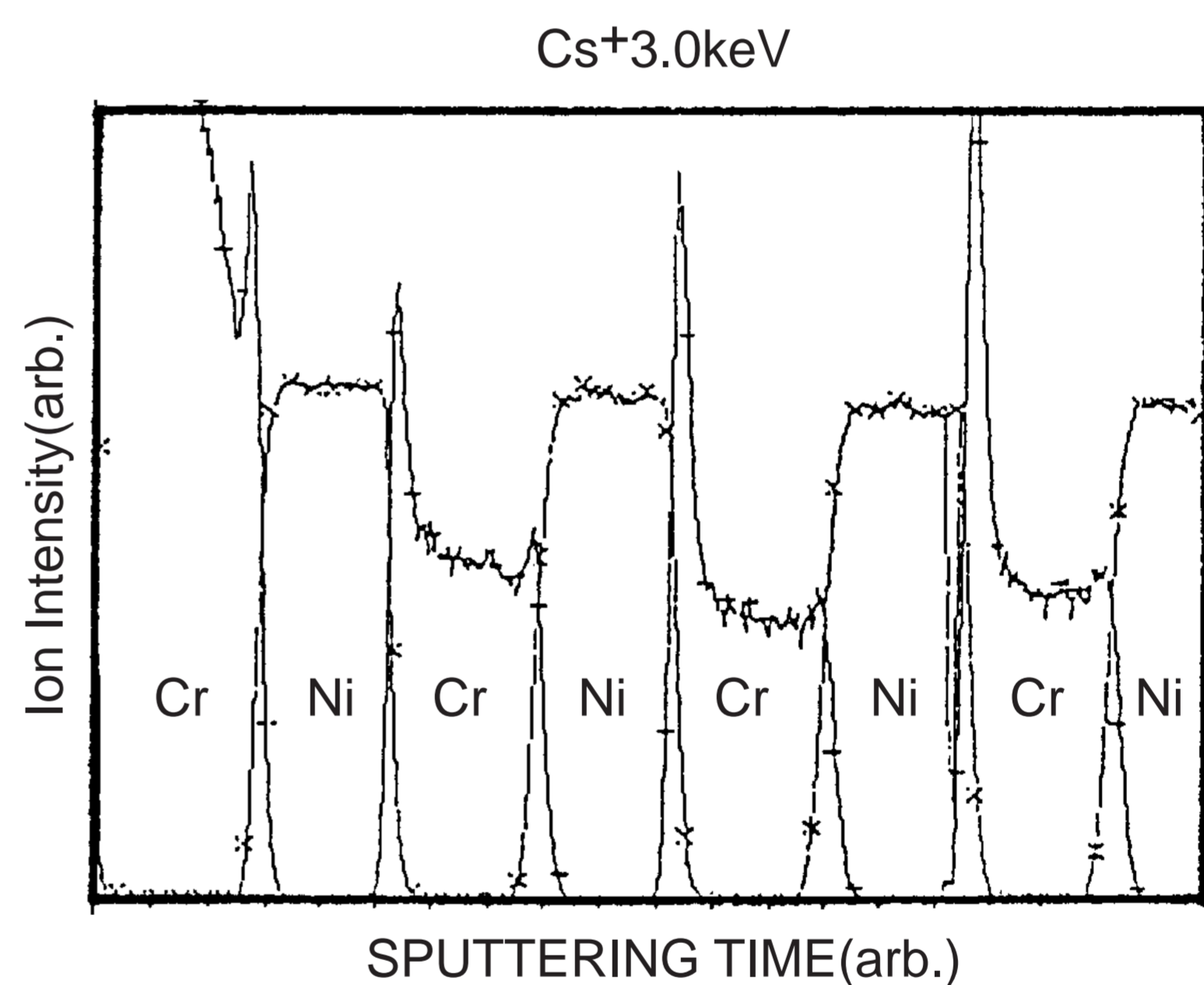
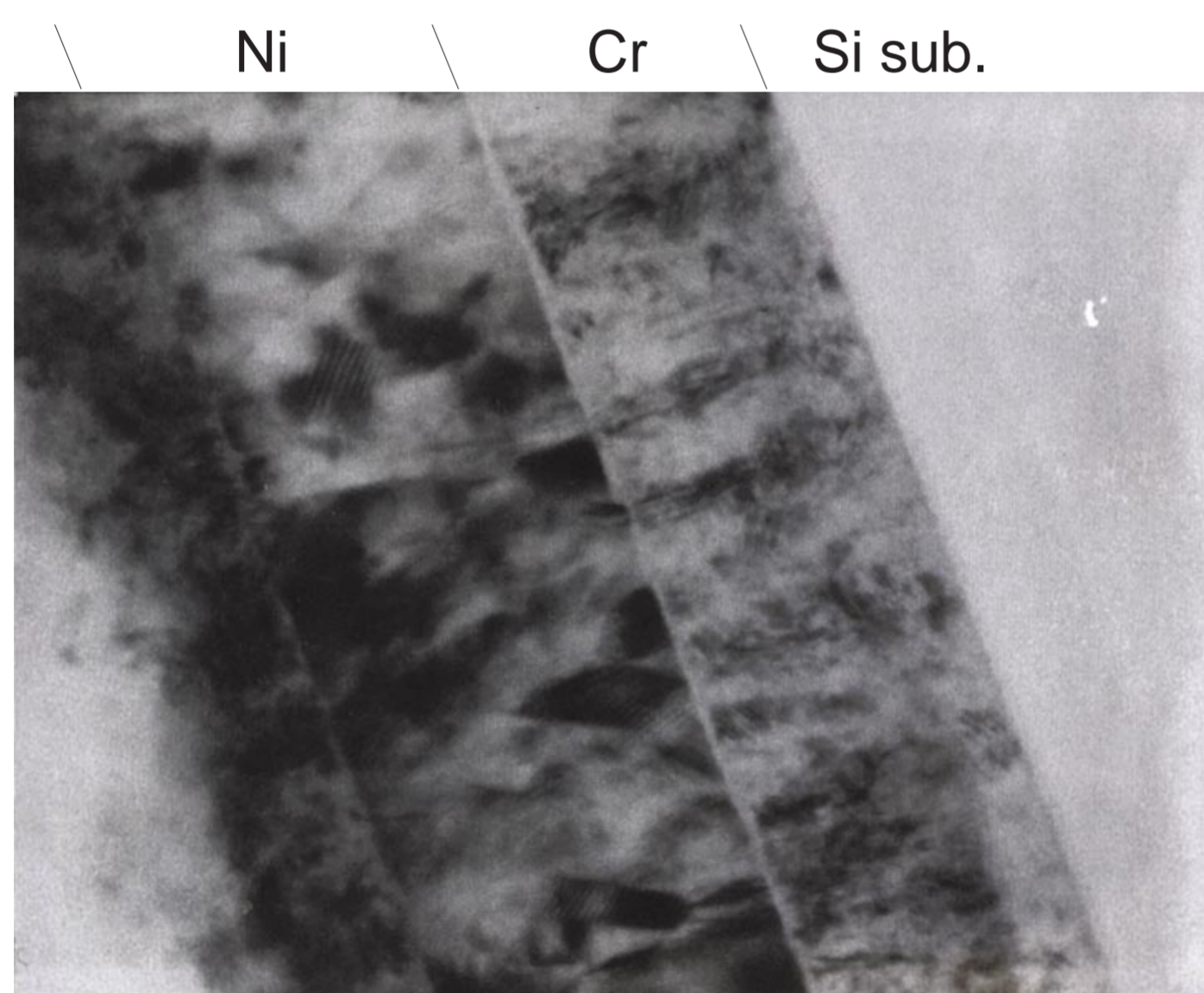
- SIMS : 高感度極微量元素分析 (H ~ U、ppb ~ ppm)
数 ~ 数10nmの深さ分解能でデプスプロファイル可能
- FE - AES : サブミクロン領域表面組成分析、深さ方向組成分析

【適用分野】

- SIMS : 半導体材料の極微量元素分析、深さ方向分析
金属材料表面酸化層の深さ方向元素定量分析
薄膜多層成膜試料の深さ方向分析
- FE - AES : 微小異物、析出相解析、
薄膜多層成膜試料などの深さ方向分析

【適用例】

Ni / Cr多層膜の深さ方向解析



GaAs / AlAs多層膜の深さ方向解析

